

3 μm スポット走査光学系

ALT - SU01

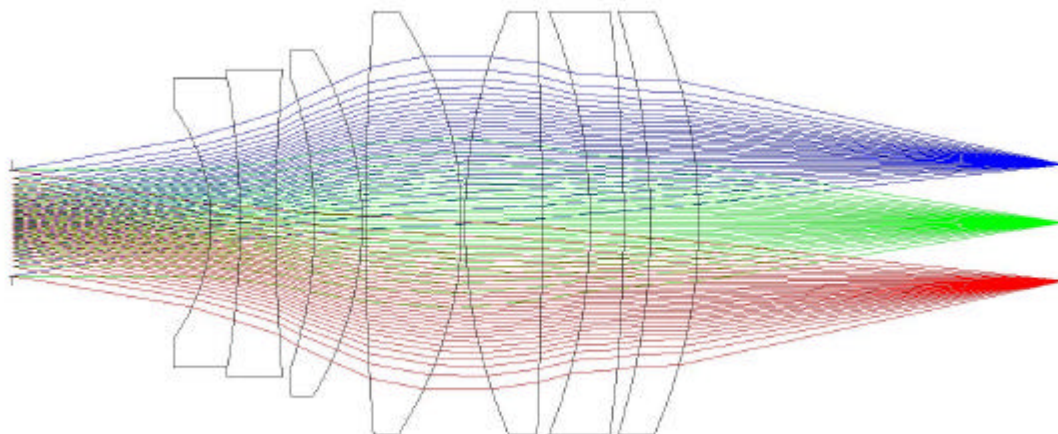
ALT - SU01 は 3 μm で 12 mm を走査する微小スポット走査光学系です。
微小な形状、欠陥、傷、異物、埃の検出に有利です。

仕様

| | | |
|---------|---------------------|----------------|
| 走査幅 | 12 mm | |
| スポット径 | 3 μm (50%) | |
| 焦点深度 | ± 8 μm | |
| 波長 | 532 nm | |
| 光出力 | 10 mW | レーザーの選定により変更可能 |
| 光出力変動率 | ± 10% 以下 | |
| 作動距離 | 35 mm | |
| 走査角度 | ± 10 度 | |
| f レンズ構成 | 6 群 7 枚 | |
| スキャナー | ガルバノスキャナー、レゾナントスキャナ | |
| ミラーサイズ | 15 ミラー | |

ポリゴンスキャナータイプにも設計変更可能です
波長変更，出力変更も対応いたします
レーザーご指定の場合 Mファクタ 1.1 以下のものを選定ください
受光光学系、受光センサ、回路、データ処理についてもご相談ください

構成



レーザー安全クラス規定に準じてご使用ください。
お問い合わせ、お求めは下記の取扱店へ

仕様は予告なく変更する場合があります。
レーザーでもっと便利に、クリエイティブに

エーエルディー株式会社

〒176-0014 東京都練馬区豊玉南 1-21-10
TEL 03-5946-7336 FAX 03-5946-7316
<http://www.alt.co.jp>
e-mail: info@alt.co.jp